

基礎、原理から学ぶ技術セミナー

— いまさら聞けない 粒径・ゼータ電位・分子量 編 —

●日 時： 令和元年 7月25日(木) 13:00～16:30

●場 所： 滋賀県工業技術総合センター 2階 大研修室

●定 員： 60名

●主 催： 滋賀県工業技術総合センター 共催： (株)三ツワフロンテック



参加費
無料

近年、装置の高度化、性能向上にともない、測定者に依存せず同じ結果を正確に出すことができる装置やボタン一つの操作で結果が出る装置が増えてきています。これらの装置は基本技術を習得せずに操作・測定することが可能であり、そのため本来測定に必要な基礎技術にふれる機会が減少しています。

今回、基礎的な話を聴く機会がない方、日常装置をご使用されている方これから使用される方に向けた「基礎、原理から学ぶセミナー」を開催いたします。

皆さまのご参加をお待ちしております。

■プログラム

13:00～14:00	<p>「粒径・ゼータ電位測定の実機使用とアプリケーション紹介」</p> <p>大塚電子株式会社 橋田 紳乃介 氏</p> <p>近年、新素材・新材料の研究・開発が盛んになっており、特に 超微粉体特有の微小性に関する機能を産業技術の一要素として取り込もうとする動きが活発化しています。 今回はその中でも代表的な測定方法である光散乱法による粒子径測定・ゼータ電位測定の基本事項、測定原理、測定例を幅広く解説します。</p> 
14:00～14:15	(休憩)
14:15～15:30	<p>「静的光散乱法による分子量測定の実機使用とアプリケーション紹介」</p> <p>大塚電子株式会社 橋田 紳乃介 氏</p> <p>近年のポリマーサイエンスでは、ポリマーの構造や形状をコントロールすることによる多機能化・高機能化が行われています。 ポリマーの基本物性である分子量測定を行う際に、標準物質を用いて相対分子量を求めるGPC等の手法では、分岐鎖の多いポリマーでは誤差が発生する、使えない溶媒がある等、様々な制限が生じます。 静的光散乱による絶対分子量測定は、これらの制限なく測定可能な測定方法であり、その特徴、測定の注意点、測定例などを幅広く解説します。</p> 
15:30～15:45	(休憩)
15:45～16:30	<p>「実機を使用してデモンストレーションと解析結果の紹介」</p> <p>※静的光散乱法に関してはモニターでの説明のみになります。 粒度分布・ゼータ電位 ELSZ-2000を使用して標準サンプルの測定と解析 静的光散乱に関しては測定結果を解析</p>

※上記講演内容、講演者は予定であり予告なく変更させて頂く場合があります。

申込締切：令和元年 7月22日(月)

お申込み先：https://www.shiga-irc.go.jp/info/news/kiso_20190725/

お問い合わせ先：滋賀県工業技術総合センター(佐々木、神澤、田中)

滋賀県栗東市上砥山232 TEL:077-558-1500/FAX:077-558-1373